

17	晶圓針測廠異常狀況排除之知識管理系統建立	
指導教授	簡禎富博士	
參與學生	890828 李曜華 890838 劉玄聖 890854 呂俊億	
摘 要		
半導體產業為國家重點產業，如何提升企業競爭力一直是大家強調的重點。本文探討並針對半導體測試的製程其異常狀況的改善與排除。測試製程乃是於 IC 構裝後測試構裝完成的產品之電性功能以保證出廠 IC 功能上的完整性，並對已測試的產品依其電性功能作分類（即分 Bin），作為 IC 不同等級產品的評價依據；最後並對產品作外觀檢驗（Inspect）作業。 本研究利用決策分析系統以及知識管理的作法，在網際網路上建構一專家系統，當晶圓針測系統出現異常，便快速的做出正確診斷方法提供工程師快速處理與解決的捷徑，不但能減少不必要的嘗試與時間上的浪費，更能使異常狀況發生的解決方法標準化，提供其他新進工程師一個快速學習、入手的好工具。本篇文章將建構完成的系統圖表列出，說明本系統如何輔助工程師做出更精確且輕鬆的決策。		